پژوهشهای نوین فیزیک (نشریه علوم دانشگاه خوارزمی)

خواص ساختاری و مغناطیسی نانوسیمهای کبالت تهیه شده با روش انباشت الکتروشیمیایی با استفاده از قالب آلومینا مهدی گلی مقدم، محمد ابراهیم قاضی*، مرتضی ایزدیفرد؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکدهٔ فیزیک دریفت: ۹۶/۸/۲۰

چکیدہ

در این کار، نانوسیمهای کبالت با قطر درحدود ۴۳ نانومتر به کمک تکنیک الکتروانباشت بر روی قالب آلومینیوم متخلخل به روش انباشت گالوانواستاتیک ساخته شدند. قالب آلومینیوم متخلخل از طریق آنودایز چندمرحلهای ورقهٔ آلومینیومی خالص ساخته شد. خواص ساختاری و ریخت شناسی سطح نانوسیمهای تهیه شده با اندازه گیری طیف پراش اشعه X و تصاویر ثبت شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه شد. نتایج نشان داد که نانو سیمها در راستای (۰۰۲) ساختار شش گوشی رشد می کنند و نانو سیمها دارای طول تقریبی سلم ۴۵ هستند. منحنیهای پسماند مغناطیسی نمونه در دو راستای میدان مغناطیسی عمود و موازی محور نانو سیمها با استفاده از یک دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) در دمای اتاق ثبت شد. این بررسی نشان داد که نانوسیمهای کبالت رفتار فرومغناطیسی را در دمای اتاق نشان میدهند و وقتی که میدان مغناطیسی عمود بر راستای نانوسیم ها اعمال میشود، نمونه دارای میدان وادارندگی بزرگتری در مقایسه با زمانی است که میدان مغناطیسی موازی نانوسیمها اعمال

واژهگان کلیدی: نانوسیم کبالت، الکتروانباشت، خواص مغناطیسی

مقدمه

در سالهای اخیر، ساخت مواد مغناطیسی که دارای ساختارهای یک بعدی همچون نانوسیمها، نانومیلهها و نانولولهها باشند به طور فزاینده مورد توجه محققین قرار گرفته است [۱]. این نانوساختارهای یک بعدی به شکل آرایهای از نانوسیمها و با قطری در محدودهٔ نانومتر و طولی بیش از میکرومتر ایجاد می شوند [۲]. تلاشهای فراوانی در ساخت آرایههای منظم یک بعدی به کمک روشهای متفاوت فیزیکی و شیمیایی انجام گرفته است. روشهایی همچون استفاده از پرتوالکترونی یا روش لیتوگرافی، پرتوافکنی با یونهای سنگین، لیزر، روشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی مثل گرما آبی و از روشهای تجمع خود به خودی که برای ساخت غشاءهای قالبها به کار می رود، نیز می توان استفاده کرد. انباشت به روش الکتروشیمیایی به کمک قالب آنودیک اکسید آلومینیوم (AAO) به دلیل سهولت و عدم احتیاج به ابزارهای گران قیمت، نرخ رشد بسیار بالا، کنترل سطح قالب با تغییر شرایط ساخت قالب [۱،۳]، رشد همزمان دو یا چند عنصر[۴]، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. در حالت کلی قالبها برای کنترل اندازه و ابعاد مواد سنتز شده و

* نویسندگان: mghazi@shahroodut.ac.ir

مورفولوژی سطح به کار گرفته می شوند. قالبها به دو صورت قالبهای پلی کربناتی و قالبهای اکسید آلومینیوم آنودایز شده تقسیم می شوند. از جمله کاربردهای این لایه های آندیک آلومینای متخلخل می توان به رشد نانولوله ها، نانو نقطه-ها، نانوسیم ها و نانومیله ها و همچنین ساختن سیستم های میکروالکتروشیمیایی اشاره کرد [۵]. در ساخت قالبهای با تخلخل بسیار بالا می توان از پیش الگوی راهنما (شابلون) و آنودایز خود نظم یافته در محلول های اسیدی استفاده کرد [۶]. این قالبها دارای کانال های استوانه ای با عمق تقریباً یکسان هستند که می توانند با نظم و چگالی بالا در کنار یکدیگر قرار گیرند. برخلاف قالبهای پلی کربناتی که کانال ها کمی نسبت به سطح مایل هستند، در قالبهای آنودیک اکسید آلومینیوم کانال ها همدیگر را قطع نمی کنند [۲۰۱]. ساخت نانوساختارهای یک بعدی همچون نانوسیمها به روش نانوسیمها، دوم رشد نانو سیمها در راستای حفره های قالب متخلخل به عنوان بستر و چهارچوبی مناسب جهت انباشت نانوسیمها، دوم رشد نانو سیم ها در راستای حفره های قالب و سوم حذف قالب و جدالی دفاوسیمها به روش نانوسیمها مستقیماً به ویژگی های سطح قالب همچون توزیع اندازهٔ حفره ها، چگالی حفرهها و زبری سطح نانوحفره ها وابسته است [۶]، لذا برای کنترل ویژگی های نانوسیمها باید به پارامترهایی که در شکل گیری و بهینه سازی قطر حفره ها و ضخامت قالب (AAO) تأثیر گذار هستند، توجه نماییم. این ویژگی ها را می توان با تغییر شرایط آنودایز موجون نوع الکترولیت، ولتاژ و زمان آنودایز کنترل نمود [۷]. قالب های اکسید آلومینیوم متخلخل را می توان در محلول همچون نوع الکترولیت، ولتاژ و زمان آنودایز کنترل نمود [۷]. قالبهای اکسید آلومینیوم متخلخل را می توان در محلول

قالب متخلخل آماده شده شامل فلز آنودایز نشده، لایهٔ سدی (لایهٔ دیالکتریک بسیار نازک)، لایهٔ متخلخل، و حفره-ها است [۸]. نوع و ماهیت الکترولیت استفاده شده در فرآیند آنودایز، تعیین کنندهٔ نوع رشد لایهٔ اکسید روی سطح فلز است. ضخامت لایهٔ سدی را میتوان در محلولهای اسیدی مثل اسید فسفوریک و اعمال پتانسیل در فرایند آنودایز کردن کاهش داد [۹،۲]. لایهٔ اکسید سدی ایجاد شده در ولتاژهای بالا یک مانع مهم برای انباشت الکتروشیمیایی به شمار میآید.

نانوسیمهای مغناطیسی چون کبالت، نیکل، آهن و آلیاژهای آنها آهن- نیکل، کبالت- آهن را می توان با روش الکتروانباشت و تجمع خود به خودی بر روی قالب اکسید آلومینیوم آنودیک ساخت [۲،۴،۱۰،۱۲]. خواص مغناطیسی آرایههای نانوسیمهای کبالت همچون نیروی وادارندگی، مغناطش اشباع و مغناطش باقیمانده به پیکربندی نانوسیمها و قطر نانوسیمها بستگی دارد. این ویژگی نانوسیمها را می توان با تغییر عوامل تأثیرگذار در ساخت قالب AAO همچون پتانسیل فرایند اکسیداسیون و PH به راحتی کنترل کرد. از جمله کاربردهای چنین آرایههای نظم دار مغناطیسی با ابعاد پایین می توان به کاربرد در ثبت مغناطیسی با چگالی بسیار بالا، سنجشهای بیولوژیکی، سنسورهای میدانی، سنسورهای شیمیایی، ابزارهای منطقی و دیگر ابزارهای الکترونیکی و اپتیکی اشاره کرد [۱۲,۶،۲].

بخش تجربى

برای ساخت قالب از ورقهٔ آلومینیوم با ضخامت ۰/۳mm و خلوص بالای ۱۹۸/ استفاده شد. ابتدا برای از بین بردن ناهمواریهای سطح و چربیزدایی ورقهٔ آلومینیوم در دمای اتاق در محلول سود (NaOH) برای مدت ۶۰ ثانیه قرار گرفت و سپس نمونه به مدت ۶۰ ثانیه در محلول یک مولار اسیدنیتریک (HNO3) قرار گرفت. آندایز اولیهٔ ورقهٔ آلومینیوم در محلول اسیدسولفوریک/۱۰ و تحت ولتاژ ۲۵ ولت DC در دمای ۲۵°۱۲برای ۶ دقیقه انجام گرفت. واکنشهای شیمیایی ایجاد شده روی سطح ورقهٔ مطابق روابط ۲ و ۳ خواهد بود [۱۳]:

Anode:
$$2Al(s) + 3H_2O \rightarrow \alpha - Al_2O_3(s) + 6H + (aq) + 6e$$
- (7)

Cathode:
$$6H+(1M) + 6e- \rightarrow 3H2(g)$$
 (7)

برای از بین بردن لایهٔ اکسید سطحی ایجاد شده، از محلول اسید فسفریک ٪۱ در دمای محیط برای ۲۰min استفاده شد. لازم به ذکر است که این محلول تنها لایهٔ اکسید ایجاد شده در سطح بیرونی آلومینیوم را از بین خواهد بـرد و بـه زیرلایهٔ آلومینیومی آسیبی نمیرساند. دومین مرحلهٔ آندایز برای مدت ۲ ساعت مشابه شرایط مرحلهٔ اول انجـام گرفت. برای حذف لایهٔ اکسید ایجاد شده در سطح بیرونی آلومینیوم را از بین خواهد بـرد و بـه برای لایهٔ آلومینیومی آسیبی نمیرساند. دومین مرحلهٔ آندایز برای مدت ۲ ساعت مشابه شرایط مرحلهٔ اول انجـام گرفت. برای حذف لایهٔ اکسید ایجاد شده در این مرحله، ورقه مجـدداً در محلـول ٪۱ اسیدفسـفریک بـرای min ۶ در دمـای محیط قرار گرفت و مجدداً برای مومین بار تحت شرایط ذکر شده مورد آندایز قرار گرفت. ضخامت لایـهٔ محیط قرار گرفت و مجدداً برای اسید فسفریک و کاهش پتانسیل سومین مرحله آنـدایز قابـل کـاهش است. سدی توسط فرایند نازککاری در محلول اسید فسفریک و کاهش پتانسیل سومین مرحله آنـدایز قابـل کـاهش است. مطح قالب آلومینیوم برای الکتروانباشت برابر ² ماه انتخاب شد. برای انباشت نانوسیم های کبالت، از محلول انباشت شامل ۱۰۰ آب مقطر سه بار یونیزه شده و rg ۴ سـولفات کبالت هفت آبـه (CoSO4.7H2O) و ۲۰۶۲ اسـید شامل ۱۰۰ آب مقطر سه بار یونیزه شده و rg ۴ سـولفات کبالت هفت آبه (CoSO4.7H2O) و ۲۹۴/۱۰ اسید برریک در ای انباشت در از ۲۰۵ استفاده شد. نمونه ها در شـرایط دوالکتـرودی، گالوانواسـتاتیک و تحت براین ثابت ² با ۲۰ الیت هفت آبه (۲۰۲۲ الینود سـمارده اسـید بریان ثابت ² به بودی ای اونواسـتاتیک و تحت بریان ثابت ² با در دمای ۱۰۵ الکتروانباشت شدند. از گرافیت نیز به عنوان الکتـرود شـمارنده اسـتفاده شد. سپس بعد از انباشت، قالب حذف و نانوسیمها به روش چرخشی بر روی زیر لایهٔ شیشه انباشت شد.

مورفولوژی سطح قالب متخلخل و نانوسیمهای کبالت توسط میکروسکوب الکترونی روبشی گسیل میدان FESEM XRD) بررسی شد. خواص ساختاری آرایههای نانوسیمهای کبالت با دستگاه پراش اشعهٔ ایکس (XRD) مدل KID300 Lake Shor) برای اندازه گیری و مدل XMD300) بررسی و از مغناطیس سنج نمونهٔ ارتعاشی (مدل VSM7400 Lake Shor) برای اندازه گیری و دستیابی به خواص مغناطیسی آرایههای نانوسیمهای کبالت استفاده شده است.

نتايج و بحث

در جدول ۱ مقادیر جریان و مقاومت الکتریکی قالب در فرایند آنودایز در ولتاژ ۲۵ ولت آورده شده است. در آنـودایز اول مشاهده می شود که جریان عبوری از نمونه کاهش و مقاومت الکتریکـی افـزایش یافتـه اسـت. در آنـودایز دوم کـه جریان برای مدت زمان های ۳۰ دقیقه ای اعمال شد، مشاهده شد که جریان در طول فرایند به شـدت کـاهش یافتـه و مقاومت افزایش می یابد که ناشی از افزایش ضخامت لایه سدی است.

زمان(min)	شروع	۶	۳۶	99	٩۶	178	108	۱۸۶	518
جريان(mA)	۷/۴۵	۵/۵۹	٣/٨١	37/82	٣/•٧	۲/۱۶	1/52	٠/٩	•/۵
مقاومت(kΩ)	٣/٣۵	۶/۴۷	۶/۵۶	۶/٩٠	٨/١١١۴	11/07	18/44	TY/YY	۵۰/۰۰

جدول ۱: مقادیر جریان و مقاومت الکتریکی قالب در فرایند آنودایزکردن

شکل ۱ تصویر FESEM قالب متخلخل ساخته شده به کمک تکنیک آنودایز چند مرحلهای را نشان میدهد. همان طور که تصویر سطح قالب نشان میدهد (شکل ۱- الف)، قطر و فاصلهٔ بین حفرهها به ترتیب حدود ۴۳nm و ۲۰nm هستند. چگالی حفرهها از مرتبه ۱۰^{۱۴} حفره برمترمربع است. در شکل۱- ب تصویر سطح مقطع قالب با حفرههای با طول بیش از ۴۵µm نشان داده شده است.



شكل ١: الف) تصوير سطح قالب آلومينا ب) تصوير سطح مقطع قالب.

در شکل ۲- الف تصویر FESEM آرایه های نانوسیمهای کبالت انباشت شده بر روی قالب متخلخل و در شکل ۲-ب تصویر FESEM نانوسیمها بعد از حذف قالب و لایه نشانی روی شیشه آورده شده است. همان گونه که مشخص است نانوسیمها مطابق الگوی قالب متخلخل و با قطری برابر حدود ۴۳nm در کنار هم رشد کردهاند.

در شکل ۳ الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) نانوسیمهای کبالت در قالب آلومینا نشان داده شده است. قلههای واقع در ۲۲/۶۰ و ۲۹=۶۴/۹۵ درجه مربوط به قالب آلومینا و قلههای واقع در ۲۹=۷۸/۰۳، ۲θ=۶۴/۳۷ و ۹۸/۹۱ و ۹۸/۹۱ درجه، ناشی از پراش از صفحات بلوری به ترتیب (۰۰۲)، (۱۰۱) و (۰۰۴) ساختار شش گوشی کبالت هستند. اندازهٔ متوسط بلورکها (D) به کمک رابطه شرر (رابطهٔ ۱) و قلهٔ (۰۰۲) محاسبه که حدود ۲۹/۱nm و از تحلیل دادههای پراش ثابتهای شبکه، a=b=۲/۵۰۵[°]A و c=۴/۰۶۰[°]A به دست آمد. شدت قله در راستای (۰۰۲) که بیش از سایر قلهها است راستای ترجیحی رشد نانوسیمها است.

$$D = \frac{\kappa \lambda}{\beta \, Cos\theta} \tag{1}$$

۰/۹ در رابطهٔ فوق λ طول موج پرتو ایکس، β پهنا در نصف شدت بیشینه، Θ زاویهٔ پراش و k ثابتی است که مقدار آن



شکل ۲: الف) نانوسیمهای کبالت در حضور قالب ب) نانوسیمهای جداشده از قالب آلومینا.



شکل ۳: طرح پراش پر تو ایکس نانوسیمهای کبالت در حضور قالب آلومینا.

جهت بررسی خواص مغناطیسی نانوسیمهای کبالت، حلقهٔ پسماند مغناطیسی آنها در دمای اتاق ثبت شد. منحنی-های پسماند مغناطیسی نانوسیمهای کبالت انباشت شده در حضور قالب برای دو راستای میدان مغناطیسی اعمالی موازی با محور نانوسیمها (H Para NW) و عمود بر محور نانوسیمها (H Vert. NW) در شکل ۴ نشان داده شده است. بیشینهٔ میدان مغناطیسی اعمالی به نمونه برابر ۱۰kG است. تصویر داخلی شکل، قسمت بزرگ شده منحنی پسماند را در میدانهای کم نشان می دهد. همان طور که شکل نشان می دهد نانوسیمها رفتار فرومغناطیسی را در دمای اتاق نشان می دهند. در شکل ۴ ملاحظه میشود که نحوهٔ و سهولت رسیدن به مغناطش اشباع برای دو راستای میدان اعمالی موازی و عمود بر محور نانوسیمها متفاوت است و مقدار میدان وادارندگی در حالت عمود بزرگتر از حالت موازی است. همچنین تفاوت در نحوهٔ تغییرات مغناطش با میدان در دو راستا نشانگر ناهمسانگردی مغناطیسی برای نانوسیمها است. مقدار میدان وادارندگی Hc وقتی میدان اعمالی عمود بر محور نانوسیمها است حدود مود کر ۲۰ را



شکل ۱: منحنیهای پسماند مغناطیسی نانوسیمهای کبالت برای دو راستای میدان مغناطیسی اعمالی موازی (H Para. NW) و عمود (H Vert. NW) بر محور نانوسیمها.

ناهمسانگردی مغناطیسی یکی از عوامل مهمی است که بر روی شکل منحنی (M-H) اثر می گذارد. منحنیهای پسماند آرایهٔ نانوسیمها ناشی از رقابت بین ناهمسانگردی شکل و ناهمسانگردی مغناطو بلوری و برهم کنش مغناطواستاتیک بین نانوسیمها است [۱۴]. عقیده بر این است که ناهمسانگردی مغناطیسی غالب، وابسته به شکل نانوسیمها است [۱۵]. نسبت چهارگوشی که به صورت نسبت مغناطش باقیمانده به مغناطش اشباع تعریف می شود برای دو جهت موازی و عمود به ترتیب برابر ۰/۱۰ ۲۰/۰ می باشد، که ناشی از برهمکنش های بلوری بالا بین نانوسیم ها است. اگر ناهمسانگردی مغناطو بلوری غالب باشد گشتاورهای مغناطیسی در راستای عمود بر محور نانوسیم و اگر ناهمسانگردی شکل غالب، محور آسان در راستای محور نانوسیم قرار می گیرد[۱۶]. بر اساس گزارش مرجع اشاره شده اخیر که نانوسیمهای با قطرهای متفاوت رشد داده شده است، منحنیهای پسماند مغناطیسی در دو راستای عمود و موازی نانوسیمها به صورت تابعی از قطر نانوسیمها و همچنین جریان انباشت تغییر میکنند. از الگوی پراش اشعهٔ ایکس نانوسیمهای رشد داده شده در این کار، شکل ۳، مشخص است که راستای ترجیحی رشد (۰۰۲) است یعنی این که نانوسیمها در راستای C رشد یافتهاند. نتایج بهدست آمده نشان میدهند که با توجه به قطر نانوسیمهای رشد داده شده وجهت گیری آنها, ناهمسانگردی مغناطو بلوری اثر غالب را داشته است.

نتيجهگيرى

قالب آلومینیوم متخلل AAo به کمک آنودایز چند مرحلهای در محلول اسید سولفوریک ساخته شد. بررسی مورفولوژی سطح قالب ساخته شده، نشان داد که دارای چگالی تخلخل از مرتبه ۱۰^{۱۴} و حفرههایی با قطر تقریبی ۴۳nm هستند. نانوسیمهای کبالت به روش انباشت گالوانواستاتیک بر روی قالب آلومینا رشد داده شدند. بررسی پراش پرتو ایکس نشان داد که راستای ترجیحی رشد، راستای (۰۰۲) است. نتایج اندازه گیری مغناطیسی نشان داد که نانوسیمها در دمای اتاق رفتار فرو مغناطیسی داشته که برای میدان مغناطیسی اعمالی موازی و عمود بر محور نانوسیمها همراه با ناهمسانگردی مغناطیسی است.

منابع

1. M. Méndez, S. González, V. Vega, J.M. Teixeira, B. Hernando, C. Luna, V.M. Prida; "Ni-Co Alloy and Multisegmented Ni/Co Nanowire Arrays Modulated in Composition: Structural Characterization and Magnetic Properties", Crystals, 7, (2017) 66; doi:10.3390/cryst7030066.

V. da Rocha Caffarenaa, J. Leixas Capitaneob, R. Antoun Simãob, A. Passos Guimarãesa;
"Preparation of Electrodeposited Cobalt Nanowires"; Materials Research, Vol. 9, No. 2, (2006)
205-208.

3. M. Lai, D. JasonRiley; "Template delectrosynthesis of nanomaterials and porous structures"; Journal of Colloid and Interface Science, 323, (2008)203–212.

4. A. Moskaltsova, M. Proenca, S.V. Nedukh, C.T. Sousa, A.Vakula, GlebN. Kakazei, S.I. Tarapov, J.P. Araujo, "Study of magnetoelasticand magnetocrystallin eanisotropiesin CoxNi1_x nanowire arrays", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 374, (2015)663–668.

5. Z. Wu, C. Richter; L. Menon "A study of anodization process during pore formation in nanoporous alumina templates"; J. Electrochem. Soc .Volume 154, Issue 1, (2007) E8-E12.

nanowires arrays grown in a trackt-etched polycarbonate membrane", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 312, (2007) 99-106.

7. S. Pal, S. Saha, D. Polley, A. Barman; "Magnetization reversal dynamics in Co nanowires with competing magnetic anisotropies"; Solid State Communications 151, (2011) 1994–1998.

8. J. Wang, Zh. Lin, "Anodic Formation of Ordered TiO2 Nanotube Arrays: Effects of Electrolyte Temperature and Anodization Potential", J. Phys. Chem. C, Vol.113, (2009) pp. 4026-4030.

9. N. ZabukovecLogar, V.Kaučič; "Nanoporous Materials: From Catalysis and Hydrogen Storage to Wastewater Treatment", ActaChim. Slov, Vol. 53, (2006) pp. 117–135.

10. M. Lai, D. Jason Riley, "Template delectrosynthesis of nanomaterials and porous structures", Journal of Colloid and Interface Science 323, (2008) 203–212.

11. T.R. Gao, L.F. Yina, C.S. Tian, M. Lub, H. Sang, S.M. Zhou; "Magnetic properties of Co-Pt alloy nanowire arrays in anodic alumina templates"; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 300, (2006) 471–478.

 A. Eftekhari, "Nanostructured Materials in Electrochemistry", WILEY-VCH (2008), ISBN: 978-3-527-31876-6

13. V.R. Caffarena, J.L. Capitaneo, R.A. Simao, A.P. Guimaraes, "Prepartion of Electrodeposited Cobalt Nanowiers", Materials Research, Vol.9, No.2, (2006) 205-208.

14. C. Wenbing , H. Mangui, D. Longjiang; "High frequency microwave absorbing properties of cobalt nanowires with transverse magnetocrystalline anisotropy" Physica B 405, (2010) 1484–1488.

15. J. M. Garcia, A. A. senjo, J. Vela'zquez, D. Garcı'a, M. Va'zquez; "Magnetic behavior of an array of cobalt nanowires" Journal of Applied Physics, Vol. 85, (1999), 5480.

16. G. Huang, W. Huang, L.Wang, B.S. Zou, A. Pan; "Orientation-controlled synthesis and magnetism of single crystalline Co nanowires", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324, (2012) 4043–4047.